

デュアルタイプ膜厚計 LZ-300J



磁性金属上と非磁性金属上の被膜の両方を測れるデュアルタイプの膜厚計です。上位器種のLZ-330Jから統計処理機能とプリンタ対応機能を除いた仕様となっています。膜厚測定は近年、素材の多様化から鉄素材と非鉄金属素材の混在化が著しく、それに対応すべくデュアルタイプの膜厚計が望まれています。本器はプローブの交換で簡単に両素材の被膜が測れます。

●仕様	LZ-300J
測定方式	電磁誘導式/渦電流式兼用
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	電磁誘導式: 0~1500 μ mまたは60.00mils 渦電流式: 0~800 μ mまたは32.00mils
測定精度	50 μ m未満: \pm 1 μ m, 50 μ m以上: \pm 2%
分解能	100 μ m未満: 0.1 μ m, 100 μ m以上: 1.0 μ m
適合規格	JIS 5600 準拠
プローブ	一点接触定圧式 (LEP-J, LHP-J)
表示方法	デジタル (LCD、表示最小桁 0.1 μ m)
電源	電池 1.5V (単3アルカリ) \times 4
寸法・質量	75 (W) \times 140 (D) \times 31 (H) mm, 0.5kg
付属品	標準板、鉄素地、アルミ素地、標準板ケース、 電池 1.5V (単3アルカリ)、プローブアダプタ、キャリングケース

デュアルタイプ膜厚計 LZ-330J



磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の両方が測定できるデュアルタイプの膜厚計です。コンパクトなボディに、統計計算、キャリブレーション・メモリ、プリンタ対応機能などの多彩な機能を装備。ケツトのきめ細かな設計思想から生まれた膜厚計です。

●仕様	LZ-330J
測定方式	電磁誘導式/渦電流式兼用
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	電磁誘導式: 0~1500 μ mまたは60.00mils 渦電流式: 0~800 μ mまたは32.00mils
測定精度	50 μ m未満: \pm 1 μ m, 50 μ m以上: \pm 2%
分解能	100 μ m未満: 0.1 μ m, 100 μ m以上: 1.0 μ m
適合規格	JIS 5600 準拠
データメモリ数	3142点
統計機能	測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値
プローブ	一点接触定圧式 (LEP-J, LHP-J)
表示方法	デジタル (LCD、表示最小桁 0.1 μ m)
外部出力	RS-232C インターフェース (転送速度 2400bps)
電源	電池 1.5V (単3アルカリ) \times 4
寸法・質量	75 (W) \times 145 (D) \times 31 (H) mm, 0.5kg
付属品	標準板、鉄素地、アルミ素地、標準板ケース、 電池 1.5V (単3アルカリ)、プローブアダプタ、キャリングケース
オプション	プリンタ (VZ-330) RS-232C 接続ケーブル データ管理ソフト「McWAVE」「MultiProp」 (McWAVE、MultiPropはCEC社の商標です。)